

# SEM ユーザーズミーティング

## プログラム

09: 30～	受付
10: 00～10: 10	開会挨拶
10: 10～10: 40	ネットワークで遠隔操作！ IoT クロスセクションポリッシャ™ IB-19540CP, IB-19550CCPの紹介 日本電子株式会社 EP事業ユニット EPアプリケーション部 長谷部 祐治
10: 40～11: 10	FIB-SEM JIB-PS500iの紹介 ～TEM試料作製から三次元測定まで～ 日本電子株式会社 EP事業ユニット EPアプリケーション部 中島 雄平
11: 10～11: 45	複合ビーム加工装置による金属構造材料の材料組織マルチ評価 ～材料組織の可視化と定量評価による新たな発見をめざして～ 国立大学法人 名古屋工業大学 佐藤 尚 様
11: 45～12: 15	昼食
12: 15～13: 00	実機・ポスター展示
13: 00～13: 30	新型 FE-SEM JSM-IT810の紹介 日本電子株式会社 EP事業ユニット EP技術開発部 新美 大伸 名越 達郎
13: 30～14: 00	電子ビーム金属3Dプリンター JAM-5200EBM と造形物の金属組織観察例の紹介 日本電子株式会社 3D積層造形プロジェクト 小岩 康三
14: 00～14: 35	文化財・美術工芸材料の微細構造を探る 東京藝術大学 北田 正弘 様
14: 35～15: 05	休憩 /実機・ポスター展示
15: 05～15: 40	安定同位体標識生物試料の二次イオン質量分析 -微細構造相関解析 国立大学法人 広島大学 久我 ゆかり 様
15: 40～16: 10	EDS-MAPのコツ！ ～データの取得方法から解析まで～ 日本電子株式会社 ソリューション開発センター ソリューション推進部 八幡 英里香 E X事業ユニット E X技術開発部 藤井 敦大
16: 10～16: 20	閉会挨拶
16: 20～17: 30	懇親会 /実機・ポスター展示

\*プログラムは予告無く変更させていただく場合がございます。予めご了承頂きますようお願い申し上げます。